ソリューションシェアリング法によるペプチド配向膜の作製とラマン分光による構造評価

Preparation of Peptide Oriented Films by Solution Sharing and Their Structural

Characterization by Raman Spectroscopy

茂田井和紀<sup>[1]</sup>、早水裕平<sup>[1]</sup>

[1] 東京工業大学物質理工学院材料系

Kazunori Motai, Yuhei Hayamizu Department of Materials Science, Tokyo Institute of Technology

ペプチドの自己組織化構造は、その多様なナノ構造から生じるユニークな電気的・光学的 特性により、近年、基礎的な関心を集めている。この分野の課題の一つは、基板上に配向 したナノ構造を形成することである。より実用的なエレクトロニクス応用のためには、ラ ンダムな配向により固有の物理的特性を失うことなく、基板上にナノ構造の薄膜を形成す ることが重要である。ここでは、結晶化したアミノ酸やジペプチドの薄膜を、ソリューシ ョンシェアリング(以下 SS 法)によって形成する技術を開発した。この薄膜の構造を、偏光 ラマン分光法と X 線回折 (XRD) 測定を用いて明らかにした。ラマンスペクトルから、SS 法によって、せん断方向に沿って結晶の向きを制御することで、Si ウエハー上に結晶性の アミノ酸やジペプチドの薄膜を形成できることがわかった。XRD スペクトルは、ラマンス ペクトルの結果を裏付けるものであり、面外方向に結晶が配向していることも明らかにな った。この研究により、溶液プロセスによってペプチドのナノ構造が簡易に基盤上に作製 可能なことが示された。ペプチドのエレクトロニクス素子への応用が期待される。

## 1. 初めに

ペプチドは水溶液中で自己組織化し、多種 多様なナノ構造を形成する。ナノ構造の形 成により、圧電性や焦電性・蛍光特性や電 気伝導特性など様々な固体材料としての物 性を発現し、新しいエレクトロニクス材料 として注目を集めている<sup>[1]</sup>。エレクトロニ クス素子への応用を考える際、基板上に均 ーかつ大面積に低コストでナノ構造を形成 する構造は異方性が高く、そのような加工 が困難であった。また、ラマン分光は局所 的な分子レベルでの配向を明らかにするこ とができるが、ペプチドにおける知見が限 られている。 2. 本研究の目的

そこで本研究では、ソリューションシェア リングと呼ばれる手法に注目し、手法の開 発を行うことを目的とした。まず、本手法を



図 1 ソリューションシェアリングのリ アルタイムイメージ

用いてペプチドの大面積配向膜を作製した。 次に、ラマン分光及び X 線回折法を用いて 得られた配向膜の構造解析を行った<sup>[2]</sup>。

3. 実験結果及び考察

ソリューションシェアリング法を行うため に、自作した装置を図.1(a)に示す。Si 基板 上に溶液を垂らし、スライドガラスで挟ん だ。その結果スライドガラスの端面でメニ スカスが形成され、溶液の乾燥及び濃縮が 起こる。濃縮が起こった結果溶液中の分子 の結晶化が起こり Si 基板上に薄膜が形成さ れる。結晶成長の速度に合わせて、自動ステ ージを掃引することにより薄膜の形成を行 った。薄膜の形成には図.1(b)で示す芳香環 を含んだアミノ酸及びジペプチドを用いた。 これらの分子はそのππ相互作用により結 晶性の高い構造を形成することが期待され る。図.1(c)は、薄膜形成の様子のタイムラ プス画像である。0s時点で見られる紫の部 分は Si 基板上の酸化膜に由来する干渉色 である。3sの時点では形成される構造がラ

ンダムに配向していることが分かる。8sの 時点を境に徐々に形成される構造が掃引方 向に揃っていき、19s時点では均一性の高 い配向膜が形成されることが分かる。薄膜 が緑色を示すのは光の多重反射に由来する 干渉の影響であると考えられる。得られた 薄膜の厚さを AFM で測定したところ約 300 nm であった。また掃引速度をより速く することで、より薄い薄膜を調整する事も 可能である。

形成される構造は主に掃引速度と基板温度 に依存するため、そのパラメータ依存性を 図.2(a)に示した。大面積に構造が形成され るためその構造を示すのに特徴的な部分を 撮影した。その結果から主に 2 つの傾向が 見られた。DF の 70 度での結果の比較から、 掃引速度を早くするほど配向の向きがそろ っていく様子が分かる。また、F 及び DF で の室温及び 70 ℃での結果の比較から温度 を高くするほどその被覆率が高くなってい る様子が分かる。最終的に掃引速度 100 μ



図 2 (a)形成される構造のパラメーター依存性 (b)(c)作製した薄膜の被覆率と配向性 パラメーターの場所依存性



図 3 (a)薄膜の角度分解ラマンスペク トル(b)ピーク強度のポーラープロット

m/s, 温度 70 °Cで 500  $\mu$  m 四方以上の均 一な配向膜を作製することに成功した。得 られる構造には場所依存性があるため、そ の場所依存性を図.2 (b)及び(c)に示した。 その結果、薄膜の形成が進行するとともに 基板に対する被覆率及び配向性が増加する ことが分かった。配向性パラメータを算出 するために画像解析ソフト Image J を用い て構造の配向の分布を算出し、次の式を用 い て 分 布 か ら Hermans orientation parameter の値を計算した。配向性パラメー タの値が0の時は完全なランダム配向、1の 時は完全な一軸配向に対応する。

次に得られた配向膜の分子レベルでの配向 性を明らかにするために、角度分解ラマン スペクトルを測定した。ラマンスペクトル に現れるピーク強度は、レーザーの偏光方

向に対して偏光依存性を示し、その強度は そのピークに由来する原子団の向きに由来 する。配向膜に対して掃引方向を0度とし、 レーザーの偏光面を回転させることで角度 分解ラマンスペクトルを得た。その結果が 図.3(a)である。F及びDFともにそのピー ク強度が顕著な偏光依存性を示したことか ら、得られた薄膜が分子レベルで配向して いることを明らかになった。矢印で示した ピークについて、ローレンツ関数によるフ ィッティングを行い、その強度を角度に対 してプロットしたものを図.3(b)に示した。 それぞれ 1200 cm<sup>-1</sup>のピークは芳香環の振 動に由来するピークであり、Fの1320cm<sup>-1</sup>, 3055 cm<sup>-1</sup>のピークはそれぞれ CH<sub>2</sub> 伸縮及 び芳香環の CH 伸縮に由来するモードであ る。1660cm<sup>-1</sup>のピークはペプチドの結合の アミド骨格に由来するピークであり、C=O の向きにピークの強度が強くなることが知 られている。そのポーラープロットの結果 から掃引方向に対して平行にアミドの C=O 骨格が並んでいることが分かる。また、 これらの結果をもとに F について配向膜の ドメイン毎の角度の分布の算出も行った。 具体的にはレーザーの偏光角 0 度と 90 度 でのラマンスペクトルの測定を行い、場所 ごとの強度比を算出した。図.3(b)で得られ ているポーラープロットから配向の角度に 対するピーク強度比の理論的なプロットを 作製し、その偏光比がとりえる値の算出を 行った。その結果を比較し、得られた薄膜が 30 度以下のドメインの配向分布を示すこ とを明らかにした。

最後に得られた薄膜について粉末 X 線回折 測定を行い、既知の単結晶構造との比較を 行った。図.4(a)と(b)が F の X 線回折測定



図. 4 (a)(b) 作製した F 薄膜の X 線回折測定の結果とドロップキャストサンプル及び単結晶構造から予測される結果の比較 (c)(d)DF 薄膜での結果の比較

の結果及び帰属される構造である。ソリュ ーションシェアリングによって形成された サンプルの回折パターンを S.S.と示した。 比較として溶液を乾かすことで得られる、 ドロップキャストサンプル及び試薬ボトル に含まれる結晶のサンプルを乳鉢ですりつ ぶし、基板上にその粉末を乗せ X 線回折測 定を行った。試薬サンプルは結晶多形 F の サンプルではそのピークの多くが F(I)の 結晶系と同じ位置にピークを与えた。単結 晶構造との比較から薄膜は F(I)の構造を とっていると推定される。また、試薬及びド ロップキャストサンプルで見られた F(I)の (110) ピークがソリューションシェアリン グによって調整されたサンプルでは見られ なかった。これは選択配向による影響と考 えられ、直行する(002)のピークが強く出て

いることから F の薄膜は c 軸を基盤に対し て垂直に向けた芳香環と親水基の層状構造 になっていることが予測される。また、DF の薄膜はそのピークの多くが DF(I)の結晶 系と一致した。角度分解ラマンの結果から アミドの向きが掃引方向に対して平行にな っていると考えられるので、c 軸が掃引方向 に対して平行になった構造を取っていると 考えられる。

## 参考文献

[1] Reches, Meital, and Ehud Gazit. Science 300.5619 (2003): 625-627.

[2] Motai, Kazunori, et al. Journal of Materials Chemistry C 8.25 (2020): 8585-8591.